

APM32F103RCT6_IO 引脚

老化测试时应注意引脚结构类型

【FAQ】

芯片型号	APM32F103RCT6
问题类型/涉及模块	IO 引脚
简要描述	老化测试半年后出现烧坏现象
原因分析	对 600 片芯片做老化测试，半年后，有 5 片出现 IO 被烧坏的情况，排查客户应用发现，损坏的引脚是不容忍 5V 的引脚上接了 5V 上拉电阻，判断是长期过压使用导致 MCU 引脚损坏。
解决方案	建议增加隔离器件或者换用容忍 5V 的引脚。

【修订历史】

日期	版本	修改记录
2022.7.25	V1.0	新建

权责说明

本文档不以任何方式对任何知识产权进行明示或默示的授权或许可。如果本文档涉及任何第三方产品或服务，不应被视为极海授权使用此类第三方产品或服务或知识产权的保证。（除非在极海销售条款中另有说明）

如我司经销的极海产品与本文档中提出的声明和/或技术特点的规定约定不一致的，则以经销产品的销售条款为准。本文档的说明不视为以任何形式造成或扩大极海的任何责任。